# DISK FOR MEASURING FLOATING AMOUNT OF HEAD

Patent Number:

JP6215514

Publication date:

1994-08-05

Inventor(s):

YOSHIDA SHINJI

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

Application (4d)

Application Number: JP19930007740 19930120

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B21/21

EC Classification:

Equivalents:

# **Abstract**

PURPOSE:To enable easy confirmation and fine adjustment of the floating amount of a head to detect the protrusion of a disk. CONSTITUTION:The plural protrusions 4 having different heights which are the reference heights required for realizing an assurance of low floating, are provided on the surface 3a of the planar disk 3 for measuring the floating amount. Dot stated protruding parts are constituted so that the height of the protrusions is highest at the innermost circumferential side against the radial direction of the disk 3 for measuring the floating amount and becomes lower sequentially as going upon the outer circumferential side and lowest at the outermost circumferential part. Thus, the accurate floating amount is easily obtained by measuring the floating amount of a measuring head from the contact between the protrusions 4 and measuring head, without being affected by the quality of the measuring head material. Also the floating amount which is made to the reference for the assurance of the low floating amount for the measuring disk 3 is easily and accurately set in each protrusion part by adjusting the circumferential speed of a carrier of the measuring disk 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-215514

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 21/21

M 9197-5D

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-7740

(22)出願日

平成5年(1993)1月20日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 吉田 伸二

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

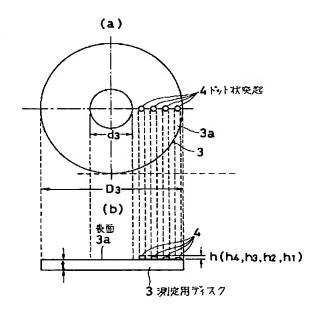
(74)代理人 弁理士 武田 元敏

## (54) 【発明の名称】 ヘッド浮上量測定用ディスク

# (57)【要約】

【目的】 ディスクの突起の検出を行うヘッドの浮上量を簡単に確認および微調整を行うことができるようにする。

【構成】 平坦な浮上量測定用ディスク3の表面3aに、低浮上保証を実現する上で必要となる基準の高さを有する、異なる高さの突起4が、複数個、前記浮上量測定用ディスク3の半径方向に対して、最内周側の突起の高さが最大で、外周側へと向かうに従って順次突起の高さが低くなり、最外周部の突起の高さが最も低くなるドット状の突起部を構成する。これは、突起4と測定用ヘッドとの接触により測定用ヘッドの浮上量を測定することから測定用ヘッドの材質に影響を受けることなく正確な浮上量を簡単に得ることができる。また測定用ディスク3担体の周速を調整することにより測定用ディスク3の低浮上量保証に基準となる浮上量が、それぞれの突起部において簡単かつ正確に設定することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 中央に開口部を有するディスクに存在す る突起の検出および切削除去をヘッドを用いて行う装置 において、低浮上化が保証されている平坦なディスクの 表面に、低浮上保証を実現する上で必要となる高さを有 する、異なる高さの突起を数個、前記ディスクの半径方 向に対して、最内周側の突起の高さが最大で、外周側へ と向かうに従い順次突起の高さが低くなっていくドット 状の突起を有することを特徴とするヘッド浮上量測定用 ディスク。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気ディスクドライブ 装置等の記憶装置のために使用される磁気ディスクの製 造技術に関するもので、特に磁気ヘッドの浮上量を測定 するヘッド浮上量測定用ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】磁気ディスクドライブ装置において、高 速回転する磁気ディスクの表面を磁気ヘッドが浮上して 記録再生を行うが、近年、磁気ディスクドライブ装置の 20 高容量化、高密度化に伴い、磁気ヘッドの浮上量はより 低浮上化が求められる傾向にある。そのため、回転して いる磁気ディスクと浮上する磁気ヘッドとの間で、両者 が接触することによるヘッドクラッシュやディスククラ ッシュを引き起こす危険性が高くなっている。

【0003】このようなクラッシュを起こす原因の1つ に、磁気ディスク表面に存在する突起により、磁気ディ スク自身の低浮上保証が実現していないことに起因する ものがある。従って、このような事故を未然に防止し、 磁気ヘッドの浮上量を安定させるため、より精密な表面 30 加工が磁気ディスク表面側に対して要求されている。こ の磁気ディスク表面の突起の検出を行う方法をグライド チェックといい、このグライドチェックは、圧電素子を 備えた突起検出用ヘッドを磁気ディスク表面に浮上さ せ、磁気ディスク上をシークすることにより行う。

【0004】この磁気ディスク表面の突起を検出するグ ライドチェック装置および突起検出用ヘッドの構成を図 7に示す。図7(a)は要部側面図、図7(b)はその要部拡 大平面図である。まず、ペース1に固定されたスピンド ル2に低浮上保証被測定用ディスク(以下、被測定用デ 40 ィスクという) 7 を装着する。次にスピンドル2が回転 することにより、被測定用ディスク7が回転し、被測定 用ディスク7の表面の突起9の有無を検出するため、圧 電素子5を備えた突起検出用ヘッド8が、図中矢印Aで 示すように被測定用ディスク7の表面を半径方向に向け て、浮上保証領域を浮上保証高さh(図略)で浮上しなが ら1回移動することにより、浮上保証高されよりも高い 突起9を検出する。このとき、突起9と突起検出用ヘッ ド8とが衝突することにより生じる衝撃力を、突起検出

の存在を判定する。

【0005】このグライドチェック工程を行うにあた り、最も重要となるのが突起9の検出を行う突起検出用 ヘッド8の浮上量である。この突起検出用ヘッド8の浮 上量は、ガラスディスクを用いたレーザー光による光干 渉ヘッド浮上測定装置を用いて、ガラスディスクの周速 を変化させてヘッド浮上量の測定を行うことにより求め られている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ガラスディス 10 クを用いたレーザー光による光干渉ヘッド浮上測定装置 を用いて、突起検出用ヘッド8の浮上量を測定する場 合、以下の問題点が存在する。

【0007】1、ガラスディスクのディスククラッシュ が発生する危険性があることから、ある一定値以下での 周速における突起検出用ヘッドの浮上量測定が困難であ る。そのため、測定可能な突起検出用ヘッドの浮上量に おいて限界があり、より低浮上時の突起検出用ヘッドの 浮上量は推定に頼られている。

【0008】2. 浮上測定を行う突起検出用ヘッドの材 質によりレーザー光の反射率も異なることから位相差の ズレが生じ、実際の浮上量と測定した浮上量との間に若 干の誤差が生じる。

【0009】3. 実際にグライドチェック工程を行うに あたり、磁気ディスクの表面に存在する突起の検出およ び切削除去を突起検出用ヘッドを用いて行う装置に、当 該突起検出用ヘッドを取り付ける際に、この突起検出用 ヘッドを治具に装着することから、ヘッド浮上測定装置 による測定した浮上量と、実際の装置における浮上量と に微妙な誤差が生じる。

【0010】より低浮上保証を実現するにあたり、上記 1. 2. 3により生じる可能性のある誤差は、いよいよ 無視できないレベルとなることから、より正確な浮上量 の測定による誤差の低減を図る必要性があった。

【0011】本発明は上記課題を解決するもので、より 正確なヘッド浮上量測定およびグライドチェック工程を 行うにあたり、必要な基準となる浮上量の設定が簡単に 図れるヘッド浮上量測定用ディスクを提供することを目 的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するために、低浮上化が保証されている平坦なディスク の表面に、低浮上保証を実現する上で必要となる高さを 有する、異なる髙さの突起を数個、前記ディスクの半径 方向に対して、最内周側の突起の高さが最大で、外周側 へと向かうに従い順次突起の高さが低くなっていくドッ ト状の突起を有することを特徴とする。このドット状突 起のなかでも、最適な高さを有する突起と浮上式の浮上 量測定用ヘッドとを接触させることにより、前記浮上量 **用ヘッド8に備えている圧電素子5により検出し、突起 50 測定用ヘッドの浮上量の測定を行うことができるヘッド** 

10

浮上量測定用ディスクを構成するものである。

#### [0013]

【作用】本発明によれば、磁気ヘッドを構成する材質お よび低浮上量に関係なく、ほぼ正確な磁気ヘッドの浮上 量が確認できる。また磁気ディスクの表面に存在する突 起の検出および切削除去を行う装置をそのまま用いるこ とにより、治具等の影響による誤差が発生することもな く、簡単に磁気ヘッドの浮上量の測定および基準浮上量 の設定を行うことが可能となる。

## [0014]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図1ないし 図6を参照しながら説明する。

【0015】図1は本発明の一実施例に係るヘッド浮上 量測定用ディスクの構成を示す平面図(a)と、その側面 図(b)である。このヘッド浮上量測定用ディスクは、磁 気ヘッドの低浮上状態における正確な磁気ヘッドの浮上 量測定が可能となるように、低浮上量保証が実現されて いる2つの平坦な表面を有するヘッド浮上量測定用ディ スク(以下、測定用ディスクという)3の片側の表面3a ト状突起は低浮上保証を実現する上で必要となる最適な 高さhを有し、かつ、それぞれの突起が異なる高さh」 <h2<h1ぐh1で構成されている。また前記ドット状 突起は、測定用ディスク3の半径方向に対して最内周側 に存在する突起の高さが最大で、外周側へと向かうに従 って順次突起の高さが低くなるように構成されている。

【0016】測定用ディスク3は一例として、本体の直 径(D<sub>3</sub>)=95±0.5mm, 中央開口部の直径(d<sub>3</sub>)=25+0.0 5mm/-0.0mm, 測定用ディスク3の厚さt=1.27±0.10 皿で構成されており、その表面はドット状突起部以外の 部分では1μ"以下(0.025μ μ以下)の完全低浮上保証が 実現されている。

【0017】測定用ディスク3上に構成されるドット状 突起は、ヘッドの浮上量hが2 $\mu$ "  $\leq$ h  $\leq$ 5 $\mu$ " (0.127 μm)において測定可能となるように、図2に例示するよ うに測定用ディスク3の表面3aに対して高さの異なる h<sub>1</sub>, h<sub>2</sub>, h<sub>3</sub>, h<sub>4</sub>の数個のドット状突起 4を構成す る。このドット状突起4は、ヘッド浮上量測定時におけ る浮上量測定用ヘッドとの衝突によるディスククラッシ ュの危険性を防止するため、硬度の向上および耐久性の 40 向上が必要とされることから、Cr, Ti, Cu, Mn, T aおよびこれらの金属の窒化物、酸化物で構成し、また 測定用ディスク3の円周方向に対する突起幅W4が、1.5 m≤s≤5mで全てのドット状突起の突起幅が一定とな るように構成している。

【0018】以下に、本発明の測定用ディスクを用いた ヘッド浮上量の測定の実施例について説明する。

【0019】図3(a)の要部平面図に示すように、2つ の平坦な表面を有する磁気ディスクの表面に存在する突

いて、本発明の測定用ディスク3を前記装置のペース1 に固定されたスピンドル2に装着する。このとき、測定 用ディスク3に構成されているドット状突起4を上部に 向けて装着する。次にスピンドル2を回転させ、圧電素 子5を装着した浮上量測定用ヘッド(以下、測定用ヘッ ドという) 6 が測定用ディスク 3 の表面を半径方向に対 し、ヘッドシークを行う。測定用ディスク3の表面のド ット状突起4は、図2に示したように最外周部のドット 状突起4の高さhiが最も低く、内周側のドット状突起 4へ向かうにつれて高さh2くh3くh4と順次高くなる ように構成されていることから、測定用ヘッド6とドッ ト状突起4との衝突により生じる可能性のあるヘッドお よびディスクのクラッシュを防止するため、ドット状突 起4が存在する領域に向けて、測定用ディスク3の最外 周部から内周部へ、ある一定の周速 v で測定用ヘッド 6 を浮上させたまま、ヘッドシークを行う。

【0020】測定用ヘッド6の浮上量は、周速vを変更 することにより変化することから、周速の設定を変更す ることにより浮上量の変更が可能である。また、それぞ に、数個のドット状突起4を構成する。この数個のドッ 20 れの周速に対する浮上量は、測定用ヘッド6の加重およ びスライダーのスキー部のABS幅により、ある程度予 **測可能であることから、測定用ヘッド6の浮上量を測定** するに当り、必要な浮上量を得ることが可能であると予 想される周速に調整する。

> 【0021】測定用ディスク3の表面3aに存在するド ット状突起4は、外周部から内周部にかけて突起の高さ が順次高くなっていくことから、必要とする測定用へッ ド6の浮上量h<sub>1</sub>が、周速vにおいてh<sub>1</sub>≤5.0 μ"(h<sub>1</sub> ≤0.127 µm)の低浮上であれば、いずれかのドット状突 起4と接触する。このドット状突起4と測定用ヘッド6 とが接触したときに生じる衝撃波としての信号を、測定 用ヘッド6に装着した電圧素子5により検出する。この 衝撃波は、図4に示すように周波数200~500kHzにおい てピークとなる信号を生じる。

> 【0022】また、この衝撃波によって得られる信号 は、図5に示すような出力波形としてオシロスコープに より測定される。

【0023】この出力は、図6の衝撃波出力(縦軸)と周 速(横軸)の相関グラフに示すように、測定用ヘッド6の 周速を下げることによって浮上量を徐々に下げていくと 共に、圧電素子5により検出される衝撃波の出力も測定 用ヘッド6の浮上量とドット状突起の突起高とが一致す るポイントを臨界点として、測定用ヘッド6の浮上量が 低下するのに比例して増加することから、測定用ディス ク3に構成されているドット状突起4と測定用ヘッド6 との接触により生じる出力の測定値によって測定時の周 速における測定用ヘッド6の浮上量を確認することがで きる。

【0024】また、周速を調整することにより、測定用 起の検出および切削除去をヘッドを用いて行う装置にお 50 ヘッド 6 に装着された圧電素子 5 により検出される出力

5

信号を測定,調整することによって、測定用ヘッド6に おける正確な浮上量が簡易的に測定することが可能となる。

【0025】上記のようにして測定された出力値を測定し、ドット状突起の検出動作を中断する。前記動作を3回実行し、測定用ディスク3に構成されるドット状突起4と測定用ヘッド6とが接触したときの出力値をそれぞれ測定して平均出力値を求め、測定用ヘッド6の浮上量を求める。また、同様の方法によって、それぞれの異なる高さのドット状突起において測定することができる。

【0026】上記構成を有する測定用ディスク3を用いてヘッド浮上量を測定することにより、装置間の誤差およびヘッドの材質に影響されない浮上量を簡単に測定することが実現できる。

## [0027]

【発明の効果】以上説明したように本発明のヘッド浮上 量測定用ディスクは、低浮上化が保証されている上記測 定用ディスクの表面に、半径方向における内周部で突起 の高さが最大となり、外周部へと向かうに従い順次突起 の高さが低くなるように、ドット状突起を構成し、それ 20 ぞれのドット突起と浮上式の測定用ヘッドとを接触さ せ、接触により生じる出力値を測定することによって、 測定用ヘッドを構成する材質に関係なくほぼ正確なヘッ ド本来の浮上量を簡易的に得ることが可能となる。

【0028】上記の測定した測定用ヘッドは、そのまま磁気ディスクの表面に存在する突起の検出および切削除去を行う装置に用いることにより、正確な浮上量が得ら

れた状態で測定用ヘッドを使用することができる。それ と同じに、別工程でのヘッド浮上量測定の必要性がなく なり、工数の削減が図れる。

6

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るヘッド浮上量測定用ディスクの構成を示す平面図(a)とその側面図(b)である。

【図2】ヘッド浮上量測定用ディスクの表面に構成する 異なる高さのドット状突起の配列および突起高さを示す 図である。

10 【図3】本発明の測定用ディスクを備えたヘッド浮上量 測定用装置および測定用ヘッドの構成を示す要部平面図 (a)とその側面図(b)である。

【図4】測定用ヘッドと測定用ディスク上の突起部との 接触により検出される衝撃波出力の周波数特性である。

【図5】 測定用ヘッドと測定用ディスク上の突起部との接触により検出される衝撃波出力波形である。

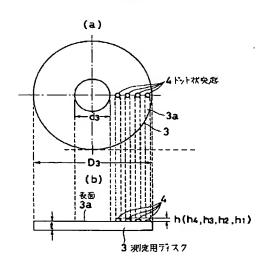
【図 6】 測定用ヘッドと測定用ディスク上の突起部との接触により検出される衝撃波出力と周速の相関グラフである。

【図7】従来例のディスク表面の突起を検出するグライドチェック装置および突起検出用ヘッドの構成を示す要部側面図(a)およびその要部拡大平面図(b)である。

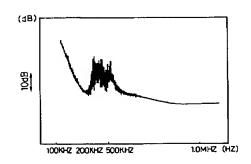
#### 【符号の説明】

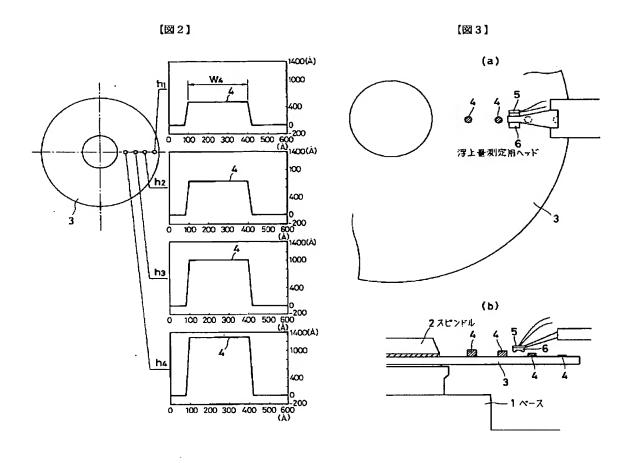
1…ベース、 2…スピンドル、 3…浮上量測定用ディスク、 4…ドット状突起、 5…圧電素子、 6… 浮上量測定用ヘッド、 7…低浮上保証被測定用ディスク、 8…突起検出用ヘッド、 9…突起。

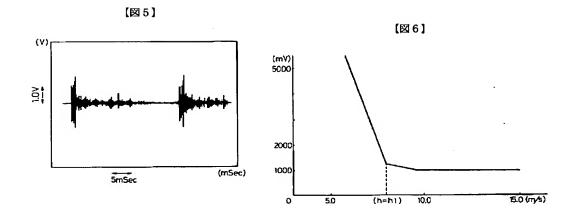
[図1]



[図4]







【図7】

